

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成26年1月23日(2014.1.23)

【公開番号】特開2012-154876(P2012-154876A)

【公開日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【年通号数】公開・登録公報2012-032

【出願番号】特願2011-16163(P2011-16163)

【国際特許分類】

G 01 R 33/032 (2006.01)

【F I】

G 01 R 33/032

【手続補正書】

【提出日】平成25年12月2日(2013.12.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

原子を含む物質を内部に封入し、光を透過させるセルと、

前記セルを透過した前記光の回転角を計測する計測部と、

前記セルに光が透過する第1領域の温度を測定する第1温度測定部と、

前記セルの光が透過しない第2領域の温度を測定する第2温度測定部と、

前記第1領域および前記第2領域の各温度のうち、少なくとも一方の温度の値が
予め定められた条件を満たす場合に、前記第1領域よりも前記第2領域の温度が低く、
且つ、前記第1領域と前記第2領域との温度差が予め定められた閾値を上回るように前記
温度差を制御する温度差制御部と

を備えることを特徴とする磁場測定装置。

【請求項2】

前記温度差制御部は、前記第1領域と前記第2領域との前記温度差が、予め定められた
目標温度差に近づくように、当該温度差を制御する

ことを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。

【請求項3】

前記温度差制御部は、

前記温度差を拡大させる処理を行う温度差拡大部を有し、

前記温度差が、予め定められた最低温度差を下回ったときに、前記温度差拡大部に前記
処理を開始させ、

前記温度差が、予め定められた最高温度差を上回ったときに、前記温度差拡大部に前記
処理を停止させる

ことを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。

【請求項4】

前記温度差制御部は、

前記第2領域を冷却する冷却部を有し、

前記冷却部に前記第2領域を冷却させることにより前記温度差を拡大させる

ことを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。

【請求項5】

前記温度差制御部は、

前記第1領域を加熱する加熱部を有し、
前記加熱部に前記第1領域を加熱させることにより前記温度差を拡大させる
ことを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。

【請求項6】

前記温度に関する値は、前記温度の単位時間あたりの変化を示す温度変化速度であり、
前記温度差制御部は、前記温度変化速度が予め定められた閾値を上回った場合に、前記
温度差を制御する
ことを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。